

測定例1-15

(工業系)

『斜入射X線回折によるセラミックス表面分析』

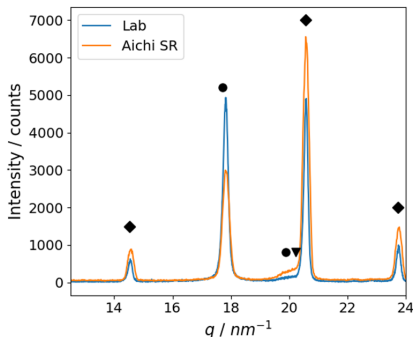
【試料】 酸化イットリウム（焼結体，溶射膜）

【測定内容】 ハロゲン暴露表面層の
非破壊深さ方向分析

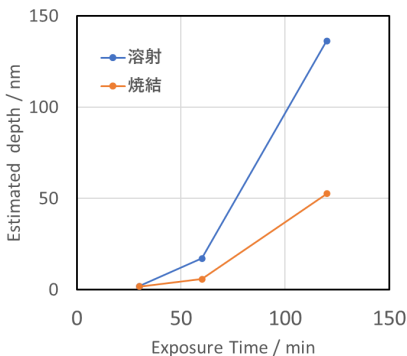
【ビームライン】 あいちSR BL8S1

【測定手法】 斜入射X線回折

ラボと放射光の比較



暴露層厚さの推定



- ・ 放射光では、より深くまでの情報
- ・ プロセスの違いによる暴露層厚さの違いを非破壊で推定